



第 5 回非鉄製錬学セミナー
Non-ferrous Extractive Metallurgy Seminar

超高分解能走査電子顕微鏡による
ナノ構造材料の観察

講師：朝比奈 俊輔



日本電子株式会社
EP事業ユニット EPアプリ部 SEMチーム リーダー
博士(工学)

E-mail: sasahina@jeol.co.jp

□概要

最近の走査電子顕微鏡は数 nm という微細な構造を明瞭に観察できるようになった。本講演では、最新の走査電子顕微鏡技術の基本原理を実例と共に紹介する。さらに、新しい表面分析技術の紹介として高立体角 EDS による元素分析、高速 EBSD による結晶方位解析、軟 X 線分光法による化学状態分析についても議論したい。

□講師略歴

2003 年 4 月 日本電子株式会社 入社以来 SEM の応用研究に従事
2013 年～ 上海交通大 Guest research professor
2017 年～ 東京工業大学 非常勤講師

□日時： 2020 年 2 月 3 日(月) 13:00 – 14:30

□場所： 物理系校舎 112 講義室

□事前申し込み： 不要

□問い合わせ先： 材料工学専攻 非鉄製錬学講座

谷ノ内 勇樹

taninouchi.yuki.4c@kyoto-u.ac.jp